

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12083-01-11
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: **02.12.2025**

Ausstellungsdatum: 02.12.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-12083-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein, 74357 Bönnigheim

mit dem Standort

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein, 74357 Bönnigheim

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

Untersuchungen von Oberflächen auf Faserstäube (Asbest)

*Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.
Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)*

Dem Laboratorium ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, genormte oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen der Normen zu verwenden.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

1 Bestimmung von Faserstäuben auf Oberflächen

DIN ISO 16000-27 2014-11	Innenraumluftverunreinigungen – Teil 27: Bestimmung von abgelagerten Faserstäuben auf Oberflächen mittels REM (Rasterelektronenmikroskopie) (direkte Methode)
-----------------------------	---

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung